

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК – ЗАПАД: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ» (EAST – WEST DESIGN & TEST CONFERENCE)

7–21 сентября 2003 г. в Крыму, в Алуште, Харьковским национальным университетом радиоэлектроники (бывший ХИРЭ) была организована первая в СНГ международная конференция, почти полностью посвящённая вопросам диагностирования и тестопригодного проектирования современных цифровых устройств.

Конференция проходила в комфортабельном санатории-отеле «Дубна», принадлежащем Объединённому институту ядерных исследований в подмосковной Дубне. Отель в очень хорошем состоянии, недорогой и с замечательным обслуживанием. Институт проблем управления принимал участие в работе Оргкомитета, но, надо сказать, харьковчане самостоятельно проделали большую и трудную работу, основная тяжесть которой пала на плечи проф. *В. И. Хаханова*. Большую помощь в организации «западной» части конференции оказал *Р. Убар*, профессор Таллиннского технического университета, выпускник «наших» школ по технической диагностике.

На конференции планировалось собрать довольно узкий круг, около 40 чел., ведущих специалистов – половина из СНГ, в основном из России, Украины и Белоруссии и половина из западных по отношению к ним стран: США, Англии, Франции, Германии, Италии, Швеции, Польши, Чехии, Словакии, Эстонии, Литвы. Из стран СНГ приехало больше намеченной квоты, но все были радушно приняты.

Конечно, эта конференция отличалась от феерических школ-семинаров и Всесоюзных конференций по технической диагностике и отказоустойчивости, проводимых ранее в СССР под руководством чл.-корр. РАН *П. П. Пархоменко* с 1968 по 1993 гг. Воспоминания о них до сих пор живы у всех участников из бывшего СССР, но прошедшие трудные времена ещё раз показали, что в науке расслабляться нельзя, коллеги могут уйти далеко вперёд, а быть всё время в роли догоняющего – мало приятно.

Проблемы диагностирования и тестопригодного проектирования вот уже 30 лет не теряют своей актуальности. В частности, и в силу своей исключительной трудности решения. Оптимизация генерации тестов, оценка их полноты, встроенные системы самотестирования, проблемы верификации проектируемых систем в финансовом отношении поглощают более 40% стоимости разработки новых изделий. Здесь есть где развернуться всем – от математиков до экономистов и организаторов производства. Сейчас владение знаниями и технологиями, связанными с тестово-диагностическими проблемами, составляют одно из главных «ноу-хау»

фирм-производителей. И все детали этих знаний держатся в большом секрете от конкурентов и фирм, занимающихся «клонированием». Последним трудно выдержать конкуренцию по качеству без этих знаний.

Наши западные коллеги привезли с собой много постановочных лекций, как принято говорить в народе «туториалов». И, на мой взгляд, честно говоря, они не очень представляли, какой огромный запас знаний и потенциал сохранился у тех специалистов, которые прошли горнило наших школ-семинаров по технической диагностике. Это лишь раз подчёркивает большое значение и абсолютную необходимость поддержки научных школ как питомников по выращиванию знаний и воспитания нового научного поколения.

Работа конференции проходила последовательно в четырёх секциях. В секции «Современные методы тестирования и тесты, ориентированные на классы дефектов» доминировали представители западной школы из Франции, Германии, Польши, Чехии, США, Швеции, Словакии, Литвы. В секции «Генерация тестов и моделирование неисправностей» много интересных докладов было из СНГ: из Владивостока, Саратова, Томска, Харькова, Донецка, Владимира. Давно и плодотворно этими проблемами занимаются в Эстонии. На секции «Встроенные системы и отказоустойчивость» выступили исследователи из Харькова, Одессы, Москвы, Киева, Праги. Около десяти докладов было заслушано на секции «Проектирование и верификация». Здесь доминировала молодёжь из Харьковского университета радиоэлектроники. Трудно в коротком информационном обзоре отразить многообразие и специфику подходов к решению проблем диагностирования современных систем, я могу только сказать, что с интересом слушал большую часть докладов, открывая для себя ещё мало знакомое мне или удивляясь фантазии и проницательности отдельных выступающих.

В силу международного статуса конференции почти все доклады представлялись на английском языке, и, надо сказать, наша молодёжь преуспела в этом, что радует.

Участники конференции с большим интересом ознакомились с номерами нового научно-технического журнала «Проблемы управления».

Решено проводить эту конференцию ежегодно, в те же сроки и в разных уголках побережья Крыма.

М. Ф. Каравай

☎ (095) 334-77-39

E-mail: mkaravay@ipu.rssi.ru

